

収録範囲	全技術分野		
ファイル種類	文献データベース		
特徴	シソーラス アラート (自動 SDI 検索) CAS RN® (CAS 登録番号) <input type="checkbox"/> Keep & Share <input checked="" type="checkbox"/> 練習用ファイル <input checked="" type="checkbox"/>	特許出願人コード (/PACO) 毎週 (デフォルト), 毎月 ページイメージ <input type="checkbox"/> 中間一致・ 後方一致検索 <input checked="" type="checkbox"/> 構造図 <input type="checkbox"/>	STN AnaVist <input type="checkbox"/> STN Easy <input checked="" type="checkbox"/>
レコード内容	<ul style="list-style-type: none"> WPI ファイルの書誌情報, 特許ファミリー情報 審査官引用 (特許, 文献) 被引用特許情報 		
レコード数	11,071,000 件以上のレコード (2011 年 7 月現在) 98,000,000 件以上の引用特許情報 (2011 年 1 月現在) 11,000,000 件以上の引用文献情報 (2011 年 1 月現在)		
収録年代	1973 年 -		
更新頻度	毎週更新		
言語	英語		
データベース 製作者	Clarivate Analytics (UK) Limited Friars House, 160 Blackfriars Rd. London SE1 8EZ United Kingdom Copyright Holder: Clarivate Analytics	クラリベイト・アナリティクス・ ジャパン株式会社 (日本法人) 〒107-6119 東京都港区赤坂 5-2-20 赤坂パークビル 19F	
収録源	<ul style="list-style-type: none"> オーストリア スイス ヨーロッパ特許庁 イギリス 韓国 ノルウェー シンガポール 南アフリカ オーストラリア チェコ スペイン アイルランド ルクセンブルグ ニュージーランド 米国 中国 ベルギー ドイツ フィンランド イタリア マレーシア フィリピン スウェーデン カナダ デンマーク フランス 日本 オランダ ロシア PCT 出願 		
検索補助 資料	<ul style="list-style-type: none"> STN 技術資料 http://www.jaici.or.jp/stn/stn_doc_01.html DPCI Reference Manual http://www.stn-international.de/dpciman.html オンラインヘルプ => HELP DIRECTORY ですべての利用可能なヘルプメッセージが表示されます STNGUIDE ファイル 		
利用可能な クラスター	• ALLBIB	• HPATENTS	• PATENTS

ヨーロッパ

STN カールスルーエ

FIZ Karlsruhe
P.O. Box 2465
76012 Karlsruhe
Germany
Phone: +49-7247-808-555
Fax: +49-7247-808-259
E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de
Internet: www.stn-international.de

日本

STN 東京

一般社団法人 化学情報協会
〒113-0021 東京都文京区本駒込6-25-4 中居ビル
Phone: 0120-003-462 (Help Desk)
: 0120-151-462 (上記以外)
Fax: 03-5978-4090
E-mail: support@jaici.or.jp (Help Desk)
customer@jaici.or.jp (上記以外)
Internet: www.jaici.or.jp

北アメリカ

STN コロンバス

CAS
P.O. Box 3012
Columbus, Ohio 43210-0012 U.S.A
CAS Customer Care:
Phone: 800-753-4227 (North America)
614-447-3700 (worldwide)
Fax: 614-447-3751
E-mail: help@cas.org
Internet: www.cas.org

SEARCH および DISPLAY フィールド

中間一致および後方一致検索可能なフィールドはアスタリスク (*) で示してあります。

WPINDEX/WPIDS/WPIX ファイルに基づく特許フィールド (Master Family)

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
基本索引 * 標題 (/TI) (以上からの切出し語)	なし または /BI	S DRILLING FLUID AND EMULS? S PHENYLETHER? S ULCER TREATMENT	TI
出願国 ^{1), 2)} (コードおよび国名)	/AC	S AU/AC S AUSTRALIA/AC	ADT
レコード番号	/AN	S 1993-126101/AN	AN
出願日 ^{1), 2), 3)}	/AD	S FR/PC(P) 19860602/AD	ADT
出願番号 ^{1), 2), 4)}	/AP	S GB1989-219641/AP S 1989GB-0219641/AP	ADT
出願タイプ ^{1), 2)}	/APT	S RELATED TO/APT	ADT
出願番号 (ClarivateAnalytics) ^{1), 2)}	/APTS	S 1949GB-000017120/APTS	ADT, APTS
出願年 ^{1), 2), 3)}	/AY	S 1990-1991/AY	ADT
特許発行国数 ³⁾	/CYC	S 20-30/CYC	CYC
図面の数 ^{2), 3)}	/DRWN	S 9-10/DRWN	PI
指定国 ²⁾	/DS	S BE/DS S RW: BE/DS(P) 1990/PY	DS, PI
資料種類 (コードおよびテキスト)	/DT	S L7 AND P/DT S UTILITY MODEL/DT	表示されない
ダウメントアップデート (DPCI) ^{1), 3)}	/DUPD	S 200709/DUPD	DUPD
ダウメントアップデート ^{2), 3)}	/DW	S 199108/DW S 199301-199315/DW(P)FR/PC	PI
ダウメントアップデート, Basic 特許 ^{2), 3)}	/DW. B	S 199315/DW. B(P)US/PC. B	PI
入力日 (DPCI) ³⁾	/ED	S ED>20080101	ED
フィールドの存在	/FA	S FDT/FA	FA
出願経過の詳細 ^{2), 4)}	/FDT	S US5072794/FDT S EP-105613/FDT	FDT
出願経過の詳細, 特許発行国 (コードおよび国名)	/FDT. PC	S AUSTRIA/FDT. PC	FDT
出願経過の詳細, 特許種別コード	/FDT. PK	S ATA/FDT. PK	FDT
出願経過の詳細, 特許番号 ⁴⁾	/FDT. PN	S AT2000000032/FDT. PN	FDT
出願経過の詳細, 出願タイプ	/FDT. TP	S BASED ON/FDT. TP	FDT
発明者名	/IN または /AU	S HALE, A H/IN S HALE, A H/AU, PA	IN (AU)
言語 ²⁾ (コードおよび言語名)	/LA	S FR/LA(P)EP/PC S FRENCH/LA(P)EP/PC(P) 1990/PY	PI
特許出願人 ⁵⁾	/PA または /CS	S SHELL OIL/PA S "NEW YORK WIRE"?/CS	PA (CS)
特許出願人コード	/PACO	S SHEL/PACO	PA (CS)
特許発行国 ^{1), 2)} (コードおよび国名)	/PC	S GB/PC(P) 1989/AY S UNITED KINGDOM/PC	PI
特許発行国, Basic 特許 ²⁾ (コードおよび国名)	/PC. B	S GB/PC. B(P) 19900404/PD. B	PI
DPCI 更新週 ³⁾	/PCIW	S 201104/PCIW	表示されない
DPCI 更新週, Basic 特許 ³⁾	/PCIW. B	S 201101/PCI. B	表示されない
DPCI 更新週, 被引用情報 ³⁾	/PCIW. G	S 201073/PCIW. G	表示されない
発行日 ^{2), 3)}	/PD	S 19900404/PD S 19900401-19900415/PD(P)GB/PC	PI
発行日, Basic 特許 ^{2), 3)}	/PD. B	S 19930330/PD. B(P)US/PC. B	PI
ページ数 ^{2), 3)}	/PGN	S 10-15/PGN	PI
特許種別コード ^{1), 2)}	/PK	S GBA/PK S EPA2/PK(P)DE/DS	PI

(続く)

WPINDEX/WPIDS/WPIX ファイルに基づく特許フィールド (Master Family)

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
特許種別コード, Basic 特許 ²⁾	/PK. B	S EPA?/PK. B	PI
特許番号 ^{1), 2), 4)}	/PN	S EPA1/PK. B(P) 1991-1992/PY. B S US5198416/PN S EP-100323/PN	PI
特許番号, Basic 特許 ^{2), 4)}	/PN. B	S US5198416/PN. B	PI
特許番号数 ³⁾	/PNC	S 5-10/PNC	PNC
種別付き特許番号 ^{2), 4)}	/PNK	S JP01000451A#/PNK	PI
種別付き特許番号, Basic 特許 ^{2), 4)}	/PNK. B	S IT774994B#/PNK. B	PI
優先権主張国 ⁶⁾	/PRC	S FR/PRC S GB/PRC(S) 1990/PRY	PRAI
優先権主張日 ^{3), 6)}	/PRD	S 19880930/PRD S 19910603/PRD(S) FR/PRC	PRAI
最先の優先権主張日 ^{3), 6)}	/PRDF	S 19910600-19910699/PRDF	PRAI
優先権出願番号 ^{4), 6)}	/PRN	S US1988-252206/PRN S 88US-0252206/PRN S DE1991-10049/PRN S 1991DE-10049/PRN	PRAI
優先権情報 (Clarivate Analytics) ⁶⁾	/PRTS	S 2007W0-JP0057175/PRTS	PRTS
優先権主張年 ^{3), 6)}	/PRY	S 1990-1991/PRY(S) NL/PRC	PRAI
最先の優先権主張年 ^{3), 6)}	/PRYF	S 1992/PRYF	PRAI
発行年 ^{2), 3)}	/PY	S 1990-1991/PY	PI
発行年, Basic 特許 ^{2), 3)}	/PY. B	S 1990/PY. B(P) JP/PC. B	PI
標題 *	/TI	S DRILLING FLUID#/TI	TI
更新日 (DPCI) ³⁾	/UP	S L7 AND UP=20110307	UP
引用情報更新日 ³⁾	/UPD	S 20110201/UPD	UPD
被引用情報更新日 ³⁾	/UPG	S 20110222/UPG	UPG

1) 同一出願に由来する特許情報と出願情報をリンクして検索するときには、(P) 演算子で検索します。

2) 同一特許情報内および同一出願情報内は (P) 演算子で検索します。

3) 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。

4) STN 形式およびダウエント形式の両方が利用できます。

5) このフィールドでは (S) 演算子はスペースで代用できます。フレーズで検索するときは、引用符で囲んで検索します。

6) 同一優先権情報内は (S) 演算子で検索します。

スーパー検索フィールド

必要な情報が含まれる一つまたはそれ以上のフィールドを検索するときは、スーパー検索フィールドを利用します。スーパー検索フィールドを利用すると、クロスオーバー検索およびマルチファイル検索が簡単に実行できます。スーパー検索フィールドで EXPAND は利用できません。代わりに個々のフィールドで EXPAND してください。

フィールド	SEARCH コード	SEARCH する フィールド	SEARCH 例	DISPLAY コード
特許出願番号および優先権 出願番号 ¹⁾	/APPS	/AP, /PRN	S GB1989-219641/APPS S 1989GB-0219641/APPS	ADT, AI, PRAI
特許番号グループ ¹⁾	/PATS	/PN, /FDT	S GB2223255/PATS S EP100323/PATS S EP-100323/PATS	FDT, PI
特許国 (コードおよび国名)	/PCS	/PC, /DS	S ES/PCS S SPAIN/PCS	PI

1) STN 形式およびダウエント形式の両方が利用できます。

DPCI ファイル特有のフィールド

審査官調査情報フィールド

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
審査官調査分類, 国際特許分類	/IC.F または /RPIC	S A61M023-00/IC.F S D06B005-12/RPIC	EXF, EXFB
審査官調査分類, 米国特許分類	/NCL.F または /RPCL	S 000032000/NCL.F S 000032000/RPCL	EXF, EXFB

引用特許フィールド - Master Family (CDP/CGP フィールドの左カラムの特許情報)

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
特許発行国	/PC.F	S BE/PC.F S BELGIUM/PC.F	CDP, CGP
特許種別コード	/PK.F	S AUA/PK.F	CDP, CGP
特許番号 ¹⁾	/PN.F	S AT395571/PN.F	CDP, CGP

1) STN 形式およびダウエント形式の両方が利用できます。

引用特許フィールド - Master Family (REN フィールドの左カラムの特許情報)

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
特許発行国 ¹⁾	/REPC	S EP/REPC	REN
特許種別コード ¹⁾	/REPK	S USA/REPK	REN
特許番号 ^{1), 2)}	/REPN	S US28990/REPN	REN

1) 同一引用情報内は (P) 演算子でリンクして検索します。

2) STN 形式およびダウエント形式の両方が利用できます。

引用特許フィールド - Cited Patent (CDP フィールドの右カラムの特許情報)

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
引用特許のカテゴリ ¹⁾	/CAT.D	S P/CAT.D	CDP
引用特許の特許発行国数 ²⁾	/IAC.D	S IAC.D>9 S 12-15/IAC.D	CTCS, CTS
引用特許の特許発行国数 (発明者引用) ^{2), 3)}	/IAC.DI	S 5/IAC.DI	CTCS
引用特許の特許発行国数 (異議申し立て) ²⁾	/IAC.DO	S 6/IAC.DO	CTCS
引用特許の特許発行国数 (第三者引用) ²⁾	/IAC.DTH	S 7/IAC.DTH	CTCS
引用特許の特許発行国数 (未定義) ²⁾	/IAC.DUN	S IAC.DUN>20	CTCS
引用特許の特許発行国数 (審査官引用) ²⁾	/IAC.DX	S 8-10/IAC.DX	CTCS
引用特許の発明者 ¹⁾	/IN.D	S BENDER M/IN.D	CDP
引用特許の発明者 (発明者引用) ^{1), 3)}	/IN.DI	S SMID, A/IN.DI	CDP
引用特許の発明者 (異議申し立て) ¹⁾	/IN.DO	S KUNZ M/IN.DO	CDP
引用特許の発明者 (第三者引用) ¹⁾	/IN.DTH	S KUNZ W/IN.DTH	CDP
引用特許の発明者 (審査官引用) ¹⁾	/IN.DX	S ANDERSON A F/IN.DX	CDP

(続く)

引用特許フィールド - Cited Patent (CDP フィールドの右カラムの特許情報)

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
引用特許の WPI レコード番号 ¹⁾	/OS. D	S 1991-376711/OS. D	CDP
引用特許の WPI レコード番号 (発明者引用) ^{1), 3)}	/OS. DI	S 1993-413679/OS. DI	CDP
引用特許の WPI レコード番号 (異議申し立て) ¹⁾	/OS. DO	S 2009-K39705/OS. DO	CDP
引用特許の WPI レコード番号 (第三者引用) ¹⁾	/OS. DTH	S 2009-K39977/OS. DTH	CDP
引用特許の WPI レコード番号 (審査官引用) ¹⁾	/OS. DX	S 1991-376711/OS. DX	CDP
引用特許の WPI レコード数 ²⁾	/OSC. D	S 12-13/OSC. D	CTCS, CTS
引用特許の WPI レコード数 (発明者引用) ^{2), 3)}	/OSC. DI	S 20-22/OSC. DI	CTCS
引用特許の WPI レコード数 (異議申し立て) ²⁾	/OSC. DO	S 5/OSC. DO	CTCS
引用特許の WPI レコード数 (第三者引用) ²⁾	/OSC. DTH	S 6/OSC. DTH	CTCS
引用特許の WPI レコード数 (未定義) ²⁾	/OSC. DUN	S 1-3/OSC. DUN	CTCS
引用特許の WPI レコード数 (審査官引用) ²⁾	/OSC. DX	S 18-20/OSC. DX	CTCS
引用特許の特許出願人 ^{1), 4)}	/PA. D	S HEIDELBERGER DRUCKMASCH?/PA. D	CDP
引用特許の特許出願人 (発明者引用) ^{1), 3), 4)}	/PA. DI	S SANYO ELEC?/PA. DI	CDP
引用特許の特許出願人 (異議申し立て) ^{1), 4)}	/PA. DO	S BASF/PA. DO	CDP
引用特許の特許出願人 (第三者引用) ^{1), 4)}	/PA. DTH	S BASF/PA. DTH	CDP
引用特許の特許出願人 (審査官引用) ^{1), 4)}	/PA. DX	S ANHEUSER BUSCH/PA. DX S SANYO/PA. DX (P) Y/CAT. D	CDP
引用特許の特許出願人コード ¹⁾	/PACO. D	S BADI/PACO. D	CDP
引用特許の特許出願人コード (発明者引用) ^{1), 3)}	/PACO. DI	S SONY/PACO. DI	CDP
引用特許の特許出願人コード (異議申し立て) ¹⁾	/PACO. DO	S SUMO/PACO. DO	CDP
引用特許の特許出願人コード (第三者引用) ¹⁾	/PACO. DTH	S HENK/PACO. DTH	CDP
引用特許の特許出願人コード (審査官引用) ¹⁾	/PACO. DX	S DIGI/PACO. DX	CDP
引用特許の特許発行国 ¹⁾ (コードおよび国名)	/PC. D	S FR/PC. D S FRANCE/PC. D	CDP
引用特許の特許発行国 (発明者引用) ^{1), 3)} (コードおよび国名)	/PC. DI	S US/PC. DI S UNITED STATES/PC. DI	CDP
引用特許の特許発行国 (異議申し立て) ¹⁾ (コードおよび国名)	/PC. DO	S AT/PC. DO	CDP
引用特許の特許発行国 (第三者引用) ¹⁾ (コードおよび国名)	/PC. DTH	S AR/PC. DTH	CDP
引用特許の特許発行国 (審査官引用) ¹⁾ (コードおよび国名)	/PC. DX	S PL/PC. DX (P) US/PC. F S POLAND/PC. DX	CDP

(続く)

引用特許フィールド — Cited Patent (CDP フィールドの右カラムの特許情報)

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
引用特許の特許発行日 ^{1), 2)}	/PD. D	S 20100107/PD. D	CDP
引用特許の特許種別コード ¹⁾	/PK. D	S DEC/PK. D	CDP
引用特許の特許種別コード (発明者引用) ^{1), 3)}	/PK. DI	S SEB/PK. DI	CDP
引用特許の特許種別コード (異議申し立て) ¹⁾	/PK. DO	S JPA/PK. DO S KRA/PK. DO	CDP
引用特許の特許種別コード (第三者引用) ¹⁾	/PK. DTH	S ITB/PK. DTH S NLA/PK. DTH	CDP
引用特許の特許種別コード (審査官引用) ¹⁾	/PK. DX	S EPB/PK. DX	CDP
引用特許の特許番号 ^{1), 5)}	/PN. D または /RPN	S DE2960217/PN. D S EP-4702/RPN	CDP
引用特許の特許番号 (発明者引用) ^{1), 3), 5)}	/PN. DI	S EP476489/PN. DI	CDP
引用特許の特許番号 (異議申し立て) ^{1), 5)}	/PN. DO	S US1160819/PN. DO	CDP
引用特許の特許番号 (第三者引用) ^{1), 5)}	/PN. DTH	S NL1026437/PN. DTH	CDP
引用特許の特許番号 (審査官引用) ^{1), 5)}	/PN. DX	S PL40533/PN. DX	CDP
引用特許数 ²⁾	/PNC. D または /CDPC	S 20-25/PNC. D	CTCS, CTS
引用特許数 (発明者引用) ^{2), 3)}	/PNC. DI	S 20/PNC. DI	CTCS
引用特許数 (異議申し立て) ²⁾	/PNC. DO	S 3/PNC. DO	CTCS
引用特許数 (第三者引用) ²⁾	/PNC. DTH	S 5/PNC. DTH	CTCS
引用特許数 (未定義) ²⁾	/PNC. DUN	S 6/PNC. DUN	CTCS
引用特許数 (審査官引用) ²⁾	/PNC. DX	S PNC. DX>50	CTCS
引用特許の特許発行日 ^{1), 2)}	/PY. D	S 2009/PY. D	CDP

- 1) 同一引用情報内は (P) 演算子でリンクして検索します。
- 2) 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。
- 3) 1997年5月までしかデータが入力されていません。
- 4) このフィールドでは (S) 演算子はスペースで代用できます。
- 5) STN 形式およびダウエント形式の両方が利用できます。

引用文献フィールド — Cited Literature

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
引用文献数 ¹⁾	/CRC	S 9-10/CRC	CTCS, CTS
引用文献数 (発明者引用) ^{1), 2)}	/CRC. I	S CRC. I>10	CTCS
引用文献数 (異議申し立て) ¹⁾	/CRC. O	S 7/CRC. O	CTCS
引用文献数 (第三者引用) ¹⁾	/CRC. TH	S CRC. TH>3	CTCS
引用文献数 (未定義) ¹⁾	/CRC. UN	S CRC. UN=20	CTCS
引用文献数 (審査官引用) ¹⁾	/CRC. X	S 10-15/CRC. X	CTCS
引用文献 ³⁾	/REN	S CLINICAL ORTHOPAEDICS/REN	REN
引用文献 (発明者引用) ^{2), 3)}	/REN. I	S (CCITT(S)DATA COMMUNICATIONS) /REN. I	REN
引用文献 (異議申し立て) ³⁾	/REN. O	S KUNZ/REN. O	REN
引用文献 (発明者引用) ³⁾	/REN. TH	S BACTERIAL/REN. TH	REN
引用文献 (審査官引用) ³⁾	/REN. X	S CHEMICAL ABSTRACTS?/REN. X	REN
引用文献カテゴリー ³⁾	/RENC	S X/RENC	REN

- 1) 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。
- 2) 1997年5月までしかデータが入力されていません。
- 3) 同一引用情報内は (P) 演算子でリンクして検索します。

被引用特許フィールド - Citing Patent (CGP フィールドの右カラムの特許情報)

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
被引用特許カテゴリー ¹⁾	/CAT. G	S D/CAT. G	CGP
被引用特許の特許発行国数 ²⁾	/IAC. G	S 5/IAC. G	CTCS, CTS
被引用特許の特許発行国数 (発明者引用) ^{2), 3)}	/IAC. GI	S IAC. GI>5	CTCS
被引用特許の特許発行国数 (異議申し立て) ²⁾	/IAC. GO	S IAC. GO>0	CTCS
被引用特許の特許発行国数 (第三者引用) ²⁾	/IAC. GTH	S 1/IAC. GTH	CTCS
被引用特許の特許発行国数 (未定義) ²⁾	/IAC. GUN	S 3<=IAC. GUN<=5	CTCS
被引用特許の特許発行国数 (審査官引用) ²⁾	/IAC. GX	S 5-10/IAC. GX	CTCS
被引用特許の発明者 ¹⁾	/IN. G	S JEROME M D/IN. G	CGP
被引用特許の発明者 (発明者引用) ^{1), 3)}	/IN. GI	S HARVEY, J M/IN. GI	CGP
被引用特許の発明者 (異議申し立て) ¹⁾	/IN. GO	S EHRNSPERGER B?/IN. GO	CGP
被引用特許の発明者 (第三者引用) ¹⁾	/IN. GTH	S EHRLICH R?/IN. GTH	CGP
被引用特許の発明者 (審査官引用) ¹⁾	/IN. GX	S REES M/IN. GX	CGP
被引用特許の WPI レコード番号 ¹⁾	/OS. G	S 1992-321151/OS. G	CGP
被引用特許の WPI レコード番号 (発明者引用) ^{1), 3)}	/OS. GI	S 1991-324342/OS. GI	CGP
被引用特許の WPI レコード番号 (異議申し立て) ¹⁾	/OS. GO	S 2007-509246/OS. GO	CGP
被引用特許の WPI レコード番号 (第三者引用) ¹⁾	/OS. GTH	S 2009-A14148/OS. GTH	CGP
被引用特許の WPI レコード番号 (審査官引用) ¹⁾	/OS. GX	S 1992-200339/OS. GX	CGP
被引用特許の WPI レコード数 ²⁾	/OSC. G	S 13-14/OSC. G	CTCS, CTS
被引用特許の WPI レコード数 (発明者引用) ^{2), 3)}	/OSC. GI	S 3/OSC. GI	CTCS
被引用特許の WPI レコード数 (異議申し立て) ²⁾	/OSC. GO	S OSC. GO>5	CTCS
被引用特許の WPI レコード数 (第三者引用) ²⁾	/OSC. GTH	S OSC. GTH=2	CTCS
被引用特許の WPI レコード数 (未定義) ²⁾	/OSC. GUN	S 20/OSC. GUN	CTCS
被引用特許の WPI レコード数 (審査官引用) ²⁾	/OSC. GX	S OSC. GX>14	CTCS
被引用特許の特許出願人 ^{1), 4)}	/PA. G	S BRUKER MESS?/PA. G	CGP
被引用特許の特許出願人 (発明者引用) ^{1), 3), 4)}	/PA. GI	S DURACELL/PA. GI	CGP
被引用特許の特許出願人 (異議申し立て) ^{1), 4)}	/PA. GO	S BULTHAUP/PA. GO	CGP
被引用特許の特許出願人 (第三者引用) ^{1), 4)}	/PA. GTH	S SIEMENS/PA. GTH	CGP
被引用特許の特許出願人 (審査官引用) ^{1), 4)}	/PA. GX	S AUGUSTINE MEDICAL/PA. GX S DURACELL/PA. GX (P) JP/PC. F	CGP
被引用特許の特許出願人コード ¹⁾	/PACO. G	S BOSCO/PACO. G	CGP
被引用特許の特許出願人コード (発明者引用) ^{1), 3)}	/PACO. GI	S GENE/PACO. GI	CGP
被引用特許の特許出願人コード (異議申し立て) ¹⁾	/PACO. GO	S DEGS/PACO. GO	CGP
被引用特許の特許出願人コード (第三者引用) ¹⁾	/PACO. GTH	S FARB-C/PACO. GTH	CGP
被引用特許の特許出願人コード (審査官引用) ¹⁾	/PACO. GX	S SATN/PACO. GX	CGP

(続く)

被引用特許フィールド - Citing Patent (CGP フィールドの右カラムの特許情報)

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
被引用特許の特許発行国 ¹⁾ (コードおよび国名)	/PC. G	S NL/PC. G S NETHERLANDS /PC. G	CGP
被引用特許の特許発行国 (発明者引用) ^{1), 3)} (コードおよび国名)	/PC. GI	S AU/PC. GI S AUSTRALIA/PC. GI	CGP
被引用特許の特許発行国 (異議申し立て) ¹⁾ (コードおよび国名)	/PC. GO	S EUROPEAN PATENT OFFICE/PC. GO	CGP
被引用特許の特許発行国 (第三者引用) ¹⁾ (コードおよび国名)	/PC. GTH	S EP/PC. GTH	CGP
被引用特許の特許発行国 (審査官引用) ¹⁾ (コードおよび国名)	/PC. GX	S GB/PC. GX S UNITED KINGDOM/PC. GX	CGP
被引用特許の特許発行日 ^{1), 2)}	/PD. G	S 20091013/PD. G	CGP
被引用特許の特許種別コード ¹⁾	/PK. G	S WOA/PK. G	CGP
被引用特許の特許種別コード (発明者引用) ^{1), 3)}	/PK. GI	S WOA/PK. GI	CGP
被引用特許の特許種別コード (異議申し立て) ¹⁾	/PK. GO	S EPA1/PK. GO	CGP
被引用特許の特許種別コード (第三者引用) ¹⁾	/PK. GTH	S EPA8/PK. GTH	CGP
被引用特許の特許種別コード (審査官引用) ¹⁾	/PK. GX	S WOA/PK. GX	CGP
被引用特許の特許番号 ^{1), 5)}	/PN. G	S CA2078966/PN. G	CGP
被引用特許の特許番号 (発明者引用) ^{1), 3), 5)}	/PN. GI	S CA2078966/PN. GI	CGP
被引用特許の特許番号 (異議申し立て) ^{1), 5)}	/PN. GO	S EP1000121/PN. GO	CGP
被引用特許の特許番号 (第三者引用) ^{1), 5)}	/PN. GTH	S EP1000863/PN. GTH	CGP
被引用特許の特許番号 (審査官引用) ^{1), 5)}	/PN. GX	S GB2279843/PN. GX	CGP
被引用特許数 ²⁾	/PNC. G または /CGPC	S PNC. G>49	CTCS, CTS
被引用特許数 (発明者引用) ^{2), 3)}	/PNC. GI	S 9-11/PNC. GI	CTCS
被引用特許数 (異議申し立て) ²⁾	/PNC. GO	S 7/PNC. GO	CTCS
被引用特許数 (第三者引用) ²⁾	/PNC. GTH	S 6<=PNC. GTH	CTCS
被引用特許数 (未定義) ²⁾	/PNC. GUN	S 3<=PNC. GUN<6	CTCS
被引用特許数 (審査官引用) ²⁾	/PNC. GX	S 30-50/PNC. GX	CTCS
被引用特許の特許発行年 ^{1), 2)}	/PY. G	S 2011/PY. G	CGP

- 1) 同一引用情報内は (P) 演算子でリンクして検索します。
- 2) 数値演算子あるいは範囲指定による検索が可能な数値検索フィールドです。
- 3) 1997 年 5 月までしかデータが入力されていません。
- 4) このフィールドでは (S) 演算子はスペースで代用できます。
- 5) STN 形式およびダウエント形式の両方が利用できます。

特許出願人コード (/PACO) シソーラス

/PACO フィールドのシソーラスを用いて、特許出願人コードと特許出願人名の対応を表示できます。この機能を用いると、簡便に会社名とコードを関連付けることができ、またコードに対応する会社名を調べることもできます。コードおよび出願人名の単語とフルネームのアルファベット順リストを表示させるには、/PACO フィールドで EXPAND してください。各コードは出現頻度および関連語 (AT) 数とともに表示されます。

利用可能なフィールド	関係コード	内 容	入 力 例
/PACO /PACO.D /PACO.DI /PACO.DO /PACO.DTH /PACO.DX /PACO.G /PACO.GI /PACO.GO /PACO.GTH /PACO.GX	ALL CODE DEF	会社名に関連するすべての特許出願人コード (SELF, DEF, CODE) 関連するコード (CODE, SELF) コードに対応するすべての会社名 (SELF, DEF)	S BAYER+ALL/PACO E PFIZER+CODE/PACO E FARB-C+DEF/PACO

DISPLAY および PRINT 形式

回答のディスプレイとオフラインプリントには、下記の表示形式を自由に組み合わせることができます。複数のコードを指定するときは、“D L1 1-5 BIB ABS”のようにスペースやカンマで区切る必要があります。フィールドは指定された順序で表示されます。

多くのフィールドでヒットタームハイライト機能が利用できます。なお、HIT, KWIC, OCC 形式を使うためには、検索時にハイライト機能が ON になっている必要があります。

特許フィールド

形 式	英 語 名	内 容	入 力 例
ADT	Application Details	出願情報の詳細	D ADT
ADT.B	Application Details, Basic	出願情報の詳細, Basic 特許	D ADT.B
AI (AP) ¹⁾	Application Information	出願情報	D AI 1-5
AI.B ¹⁾	Application Information, Basic	出願情報, Basic 特許	D AI.B
AN	Accession Number	レコード番号	D AN
CYC	Country Count	特許発行国数	D CYC
DS	Designated State	指定国	D DS
DUPD	DPCI Update	ダウエントアップデート (DPCI)	D DUPD
ED ¹⁾	Entry Date (DPCI)	入力日 (DPCI)	D ED
FA ¹⁾	Field Availability	フィールドの存在	D FA
FDT	Filing Details	出願経過の詳細	D FDT
IN (AU)	Inventor	発明者名	D IN
PA (CS)	Patent Assignee	特許出願人	D 1-10 TI PA
PI (PN) ¹⁾	Patent Information	特許情報	D PI
PI.B (PN.B) ¹⁾	Patent Information, Basic	特許情報, Basic 特許	D PI.B
PNC	Patent Number Count	特許番号数	D PNC
PRAI ¹⁾	Priority Information	優先権出願情報	D PRAI
TI	Title	標題	D TI
UP ¹⁾	Update Date	更新日 (DPCI)	D UP

1) 出願番号、優先権出願番号、特許番号は、ダウエント形式と STN 形式の両方で表示できます。STN 形式がデフォルトです。ダウエント形式に (恒久的に) 変更するときには、SET PAT DERWENT (PERM) と入力します。STN 形式に戻す場合は、SET PAT STN と入力します。

引用情報フィールド

形 式	内 容	入 力 例
CDP ¹⁾	引用特許情報 (Cited Patent) (引用特許が存在する特許番号, 引用特許カテゴリ, 引用特許番号, 引用特許発行日, 引用特許レコード番号, 引用特許出願人, 引用特許発明者)	D 10 L3 CDP
CDP.B ¹⁾	引用特許情報 (Cited Patent), Basic 特許 (引用特許が存在するベーシック特許の特許番号, 引用特許カテゴリ, 引用特許番号, 引用特許発行日, 引用特許レコード番号, 引用特許出願人, 引用特許発明者)	D CDP.B
CDPB ¹⁾	引用特許情報簡略型 (Cited Patent)	D CDPB
CGP ¹⁾	被引用特許情報 (Citing Patent) (被引用特許が存在する特許番号, 被引用特許カテゴリ, 被引用特許番号, 被引用特許発行日, 被引用特許レコード番号, 被引用特許出願人, 被引用特許発明者)	D CGP 1-3
CGP.B ¹⁾	被引用特許情報 (Citing Patent), Basic 特許 (被引用特許が存在するベーシック特許の特許番号, 被引用特許カテゴリ, 被引用特許番号, 被引用特許発行日, 被引用特許レコード番号, 被引用特許出願人, 被引用特許発明者)	D CGP.B
CGPB ¹⁾	被引用特許情報簡略型 (Citing Patent) (簡易表示)	D CGPB
CRC ²⁾	引用文献数 (CRC.I, CRC.X, CRC.O, CRC.TH, CRC.UN)	D CRC
CTCS ²⁾	引用情報数 (すべての数) (PNC.D, PNC.DI, PNC.DX, PNC.DO, PNC.DTH, PNC.DUN, IAC.D, IAC.DI, IAC.DX, IAC.DO, IAC.DTH, IAC.DUN, PNC.G, PNC.GI, PNC.GX, PNC.GO, PNC.GTH, PNC.GUN, IAC.G, IAC.GI, IAC.GX, IAC.GO, IAC.GTH, IAC.GUN, CRC, CRC.I, CRC.X, CRC.O, CRC.TH, CRC.UN, OSC.D, OSC.DI, OSC.DX, OSC.DO, OSC.DTH, OSC.DUN, OSC.G, OSC.GI, OSC.GX, OSC.GO, OSC.GTH, OSC.GUN)	D CTCS
CTS ²⁾	引用情報数簡略型 (PNC.D, PNC.G, IAC.D, IAC.G, CRC, OSC.D, OSC.G)	D CTS
EXF	審査官サーチフィールド	D EXF
EXFB	審査官サーチフィールド簡略型	D EXFB
REN ¹⁾	引用文献情報 (引用文献が存在する特許番号, 引用文献カテゴリと引用文献)	D REN
REN.B ¹⁾	引用文献情報, Basic 特許 (引用文献が存在するベーシック特許の特許番号, 引用文献カテゴリと引用文献)	D REN.B
RENB ¹⁾	引用文献情報簡略型	D RENB
UPD	引用情報更新日	D UPD
UPG	被引用情報更新日	D UPG

1) 出願番号, 優先権出願番号, 特許番号, ダウエント形式と STN 形式の両方で表示できます。STN 形式がデフォルトです。ダウエント形式に (恒久的に) 変更するときには, SET PAT DERWENT (PERM) と入力します。STN 形式に戻す場合は, SET PAT STN と入力します。

2) この形式のオンライン・ディスプレイ料金は無料です。

定型表示形式

形 式	内 容	入 力 例
ALL (MAX) ¹⁾	AN, TI, IN, PA, CYC, PI, ADT, FDT, PRAI, CTCS, EXF, CITN	D ALL 1-3
ALLB (STD) ¹⁾	すべての情報, ただし引用情報は簡略型で表示 (AN, TI, IN, PA, CYC, PI, ADT, FDT, PRAI, CTS, EXFB, CITNB) (デフォルトは ALLB)	D ALLB D 25
IALL ¹⁾	フィールド名付きインデント型 ALL 形式	D IALL
IALLB (ISTD) ¹⁾	フィールド名付きインデント型 ALLB 形式	D IALLB
ANL ²⁾	レコード番号のリスト (回答番号なし)	D ANL
APPS ¹⁾	出願番号グループ (ADT, PRAI)	D APPS
BIB ¹⁾	AN, TI, IN, PA, CYC, PI, ADT, FDT, PRAI	D BIB
IBIB ¹⁾	フィールド名付きインデント型 BIB 形式	D IBIB

(続く)

定型表示形式

形式	内 容	入 力 例
BRIEF. D ¹⁾	AN, TI, PA, CDP	D BRIEF. D
BRIEF. G ¹⁾	AN, TI, PA, CGP	D BRIEF. G
CITN ¹⁾	CDP, REN, CGP	D CITN
CITNB ¹⁾	CDPB, RENB, CGPB	D CITNB
FAM ¹⁾	PI, ADT, FDT, PRAI	D FAM 1-10
PATS ¹⁾	特許番号グループ (PI, FDT)	D PATS
SCAN ^{2), 3)}	TIA (省略型標題) (回答番号なしのランダム表示)	D SCAN
TRIAL ²⁾ (TRI, FREE, SAMPLE, SAM)	AN, TIA (省略型標題)	D TRI 1-10
HIT	ヒットタームを含むフィールド	D HIT
KWIC	ヒットタームの前後 20 語を表示 (KeyWord-In-Context)	D KWIC
OCC ²⁾	ヒットタームの出現頻度をフィールドごとに表示	D OCC

1) 出願番号, 優先権出願番号, 特許番号は, ダウエント形式と STN 形式の両方で表示できます. STN 形式がデフォルトです. ダウエント形式に (恒久的に) 変更するときには, SET PAT DERWENT (PERM) と入力します. STN 形式に戻す場合は, SET PAT STN と入力します.

2) この形式のオンライン・ディスプレイ料金は無料です.

3) SCAN はコマンドに続けて入力します. (例 : => D SCAN または DISPLAY SCAN)

SELECT, ANALYZE および SORT フィールド

SELECT コマンドは, 回答セットの指定したフィールドから抽出した語句に E 番号を付与します.

ANALYZE コマンドは, 回答セットの指定したフィールドから抽出した語句に L 番号を付与します.

SORT コマンドは, 検索結果を指定したフィールドのアルファベット順または数値順に並べ替えます.

(該当項目は Y, 該当しないものは N で表示されています)

WPINDEX/WPIDS/WPIX ファイルに基づく特許フィールド (Master Family)

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
レコード番号	AN	Y	Y
出願国	AC	Y	N
出願日	AD	Y	N
出願番号	AP (AI, ADT)	Y ²⁾	N
出願番号グループ	APPS	Y ³⁾	N
出願番号 (Clarivate Analytics)	APTS	Y	N
出願年	AY	Y	N
特許発行国数	CYC	Y	Y
指定国	DS	Y	N
ダウエントアップデート (DPCI)	DUPD	Y	Y
ダウエントアップデート	DW	Y ⁴⁾	Y
ダウエントアップデート, Basic 特許	DW. B	Y ⁴⁾	Y
入力日 (DPCI)	ED	Y	Y
フィールドの存在	FA	Y	N
出願経過の詳細	FDT	Y ⁴⁾	N
発明者名 (著者名)	IN (AU)	Y	Y
言語	LA	Y ⁴⁾	N
ヒットタームの出現頻度	OCC	N	Y
特許出願人 (所属機関)	PA (CS)	Y	Y
特許出願人コード	PACO	Y	Y
特許番号グループ	PATS	Y ^{2), 5)}	N
特許出願人コードと特許出願人	PAX	Y	Y
特許発行国	PC	Y	Y
特許発行国, Basic 特許	PC. B	Y	Y

(続く)

WPINDEX/WPIDS/WPIX ファイルに基づく特許フィールド (Master Family)

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
DPCI 更新週	PCIW	Y	Y
DPCI 更新週, Basic 特許	PCIW. B	Y	Y
DPCI 更新週, 被引用情報	PCIW. G	Y	Y
特許発行国グループ	PCS	Y	N
発行日	PD	Y ⁴⁾	Y
発行日, Basic 特許	PD. B	Y ⁴⁾	Y
特許種別コード	PK	Y	Y
特許種別コード, Basic 特許	PK. B	Y	Y
特許番号 (特許情報)	PN (PI)	Y ²⁾	Y
特許番号 (特許情報), Basic 特許	PN. B (PI. B)	Y ²⁾	Y
特許番号数	PNC	Y	Y
種別付き特許番号	PNK	Y	N
種別付き特許番号, Basic 特許	PNK. B	N	N
優先権主張国	PRC	Y	N
優先権主張日	PRD	Y	N
最先の優先権主張日	PRDF	Y ⁴⁾	Y
優先権出願番号 (優先権出願情報)	PRN (PRAI)	Y ²⁾	Y
優先権出願番号 (Clarivate Analytics)	PRTS	Y	N
優先権主張年	PRY	Y	Y
最先の優先権主張年	PRYF	Y ⁴⁾	Y
発行年	PY	Y ⁴⁾	Y
発行年, Basic 特許	PY. B	Y ⁴⁾	Y
標題	TI	Y (デフォルト)	Y
更新日 (DPCI)	UP	Y	Y

- 1) 回答セットからヒットタームだけを抽出するには HIT を使います。(例 : => SEL HIT IN)
- 2) 出願番号, 優先権主張番号および特許番号は, SET PATENT コマンドで設定されている形式 (STN 形式またはダウエント形式) で SELECT, ANALYZE および SORT されます。
- 3) 出願番号と優先権出願番号が SELECT または ANALYZE され, SELECT したタームに /APPS が付与されます。
- 4) SELECT HIT または ANALYZE HIT はこのフィールドでは使えません。
- 5) 特許番号と出願経過の詳細が SELECT または ANALYZE され, SELECT したタームに /PATS が付与されます。

DPCI ファイル特有のフィールド

審査官調査情報フィールド

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
審査官調査分類, 国際特許分類	IC. F	Y	N
審査官調査分類, 米国特許分類	NCL. F	Y	N

- 1) 回答セットからヒットタームだけを抽出するには HIT を使います。(例 : => SEL HIT TI)

引用特許フィールド - Master Family (CDP/CGP フィールドの左カラムの特許情報)

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
特許発行国	PC. F	Y	N
特許種別コード	PK. F	Y	N
特許番号	PN. F	Y ²⁾	N

- 1) 回答セットからヒットタームだけを抽出するには HIT を使います。(例 : => SEL HIT TI)
- 2) 特許番号は SET PATENT コマンドで設定されている形式 (STN 形式またはダウエント形式) で SELECT, ANALYZE されます。

引用特許フィールド - Master Family (REN フィールドの左カラムの特許情報)

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
特許発行国	REPC	Y	N
特許種別コード	REPK	Y	N
特許番号	REPN	Y ²⁾	N

1) 回答セットからヒットタームだけを抽出するには HIT を使います. (例 : => SEL HIT TI)

2) 特許番号は SET PATENT コマンドで設定されている形式 (STN 形式またはダウエント形式) で SELECT, ANALYZE されます.

引用特許フィールド - Cited Patent (CDP フィールドの右カラムの特許情報)

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
引用特許カテゴリー (審査官引用)	CAT. D	Y	N
引用特許の特許発行国数	IAC. D	Y	Y
引用特許の特許発行国数 (発明者引用)	IAC. DI	Y	Y
引用特許の特許発行国数 (異議申し立て)	IAC. DO	Y	Y
引用特許の特許発行国数 (第三者引用)	IAC. DTH	Y	Y
引用特許の特許発行国数 (未定義)	IAC. DUN	Y	Y
引用特許の特許発行国数 (審査官引用)	IAC. DX	Y	Y
引用特許の発明者	IN. D	Y	N
引用特許の発明者 (発明者引用)	IN. DI	Y	N
引用特許の発明者 (異議申し立て)	IN. DO	Y	N
引用特許の発明者 (第三者引用)	IN. DTH	Y	N
引用特許の発明者 (審査官引用)	IN. DX	Y	N
引用特許の WPI レコード番号	OS. D	Y	N
引用特許の WPI レコード番号 (発明者引用)	OS. DI	Y	N
引用特許の WPI レコード番号 (異議申し立て)	OS. DO	Y	N
引用特許の WPI レコード番号 (第三者引用)	OS. DTH	Y	N
引用特許の WPI レコード番号 (審査官引用)	OS. DX	Y	N
引用特許の WPI レコード番号の数	OSC. D	Y	Y
引用特許の WPI レコード数 (発明者引用)	OSC. DI	Y	Y
引用特許の WPI レコード数 (異議申し立て)	OSC. DO	Y	Y
引用特許の WPI レコード数 (第三者引用)	OSC. DTH	Y	Y
引用特許の WPI レコード数 (未定義)	OSC. DUN	Y	Y
引用特許の WPI レコード数 (審査官引用)	OSC. DX	Y	Y
引用特許の特許出願人	PA. D	Y	N
引用特許の特許出願人 (発明者引用)	PA. DI	Y	N
引用特許の特許出願人 (異議申し立て)	PA. DO	Y	N
引用特許の特許出願人 (第三者引用)	PA. DTH	Y	N
引用特許の特許出願人 (審査官引用)	PA. DX	Y	N
引用特許の特許出願人コード	PACO. D	Y	N
引用特許の特許出願人コード (発明者引用)	PACO. DI	Y	N
引用特許の特許出願人コード (異議申し立て)	PACO. DO	Y	N
引用特許の特許出願人コード (第三者引用)	PACO. DTH	Y	N
引用特許の特許出願人コード (審査官引用)	PACO. DX	Y	N
引用特許の特許発行国	PC. D	Y	N
引用特許の特許発行国 (発明者引用)	PC. DI	Y	N
引用特許の特許発行国 (異議申し立て)	PC. DO	Y	N
引用特許の特許発行国 (第三者引用)	PC. DTH	Y	N
引用特許の特許発行国 (審査官引用)	PC. DX	Y	N
引用特許の特許種別コード	PK. D	Y	N
引用特許の特許種別コード (発明者引用)	PK. DI	Y	N
引用特許の特許種別コード (異議申し立て)	PK. DO	Y	N
引用特許の特許種別コード (第三者引用)	PK. DTH	Y	N
引用特許の特許種別コード (審査官引用)	PK. DX	Y	N

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
引用特許の特許番号	PN. D	Y ²⁾	N
引用特許の特許番号 (発明者引用)	PN. DI	Y ²⁾	N
引用特許の特許番号 (異議申し立て)	PN. DO	Y ²⁾	N
引用特許の特許番号 (第三者引用)	PN. DTH	Y ²⁾	N
引用特許の特許番号 (審査官引用)	PN. DX	Y ²⁾	N
引用特許数	PNC. D	Y	Y
引用特許数 (発明者引用)	PNC. DI	Y	Y
引用特許数 (異議申し立て)	PNC. DO	Y	Y
引用特許数 (第三者引用)	PNC. DTH	Y	Y
引用特許数 (未定義)	PNC. DUN	Y	Y
引用特許数 (審査官引用)	PNC. DX	Y	Y

1) 回答セットからヒットタームだけを抽出するには HIT を使います. (例 : => SEL HIT TI)

2) 特許番号は SET PATENT コマンドで設定されている形式 (STN 形式またはダウエント形式) で SELECT, ANALYZE されます.

引用文献フィールド - Cited Literature

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
引用文献数	CRC	Y	Y
引用文献数 (発明者引用)	CRC. I	Y	Y
引用文献数 (異議申し立て)	CRC. O	Y	Y
引用文献数 (第三者引用)	CRC. TH	Y	Y
引用文献数 (未定義)	CRC. UN	Y	Y
引用文献数 (審査官引用)	CRC. X	Y	Y
引用文献	REN	Y	N
引用文献 (発明者引用)	REN. I	Y	N
引用文献 (異議申し立て)	REN. O	Y	N
引用文献 (第三者引用)	REN. TH	Y	N
引用文献 (審査官引用)	REN. X	Y	N
引用文献カテゴリー	RENC	Y	N

1) 回答セットからヒットタームだけを抽出するには HIT を使います. (例 : => SEL HIT TI)

被引用特許フィールド - Citing Patent (CGP フィールドの右カラムの特許情報)

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
被引用特許カテゴリー (審査官引用)	CAT. G	Y	N
被引用特許の特許発行国数	IAC. G	Y	Y
被引用特許の特許発行国数 (発明者引用)	IAC. GI	Y	Y
被引用特許の特許発行国数 (異議申し立て)	IAC. GO	Y	Y
被引用特許の特許発行国数 (第三者引用)	IAC. GTH	Y	Y
被引用特許の特許発行国数 (未定義)	IAC. GUN	Y	Y
被引用特許の特許発行国数 (審査官引用)	IAC. GX	Y	Y
被引用特許の発明者	IN. G	Y	N
被引用特許の発明者 (発明者引用)	IN. GI	Y	N
被引用特許の発明者 (異議申し立て)	IN. GO	Y	N
被引用特許の発明者 (第三者引用)	IN. GTH	Y	N
被引用特許の発明者 (審査官引用)	IN. GX	Y	N
被引用特許の WPI レコード番号	OS. G	Y	N
被引用特許の WPI レコード番号 (発明者引用)	OS. GI	Y	N
被引用特許の WPI レコード番号 (異議申し立て)	OS. GO	Y	N
被引用特許の WPI レコード番号 (第三者引用)	OS. GTH	Y	N
被引用特許の WPI レコード番号 (審査官引用)	OS. GX	Y	N

(続く)

被引用特許フィールド - Citing Patent (CGP フィールドの右カラムの特許情報)

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
被引用特許の WPI レコード数	OSC. G	Y	Y
被引用特許の WPI レコード数 (発明者引用)	OSC. GI	Y	Y
被引用特許の WPI レコード数 (異議申し立て)	OSC. GO	Y	Y
被引用特許の WPI レコード数 (第三者引用)	OSC. GTH	Y	Y
被引用特許の WPI レコード数 (未定義)	OSC. GUN	Y	Y
被引用特許の WPI レコード数 (審査官引用)	OSC. GX	Y	Y
被引用特許の特許出願人	PA. G	Y	N
被引用特許の特許出願人 (発明者引用)	PA. GI	Y	N
被引用特許の特許出願人 (異議申し立て)	PA. GO	Y	N
被引用特許の特許出願人 (第三者引用)	PA. GTH	Y	N
被引用特許の特許出願人 (審査官引用)	PA. GX	Y	N
被引用特許の特許出願人コード	PACO. G	Y	N
被引用特許の特許出願人コード (発明者引用)	PACO. GI	Y	N
被引用特許の特許出願人コード (異議申し立て)	PACO. GO	Y	N
被引用特許の特許出願人コード (第三者引用)	PACO. GTH	Y	N
被引用特許の特許出願人コード (審査官引用)	PACO. GX	Y	N
被引用特許の特許発行国	PC. G	Y	N
被引用特許の特許発行国 (発明者引用)	PC. GI	Y	N
被引用特許の特許発行国 (異議申し立て)	PC. GO	Y	N
被引用特許の特許発行国 (第三者引用)	PC. GTH	Y	N
被引用特許の特許発行国 (審査官引用)	PC. GX	Y	N
被引用特許の特許種別コード	PK. G	Y	N
被引用特許の特許種別コード (発明者引用)	PK. GI	Y	N
被引用特許の特許種別コード (異議申し立て)	PK. GO	Y	N
被引用特許の特許種別コード (第三者引用)	PK. GTH	Y	N
被引用特許の特許種別コード (審査官引用)	PK. GX	Y	N
被引用特許の特許番号	PN. G	Y ²⁾	N
被引用特許の特許番号 (発明者引用)	PN. GI	Y ²⁾	N
被引用特許の特許番号 (異議申し立て)	PN. GO	Y ²⁾	N
被引用特許の特許番号 (第三者引用)	PN. GTH	Y ²⁾	N
被引用特許の特許番号 (審査官引用)	PN. GX	Y ²⁾	N
被引用特許数	PNC. G	Y	Y
被引用特許数 (発明者引用)	PNC. GI	Y	Y
被引用特許数 (異議申し立て)	PNC. GO	Y	Y
被引用特許数 (第三者引用)	PNC. GTH	Y	Y
被引用特許数 (未定義)	PNC. GUN	Y	Y
被引用特許数 (審査官引用)	PNC. GX	Y	Y

1) 回答セットからヒットタームだけを抽出するには HIT を使います。(例 : => SEL HIT TI)

2) 特許番号は SET PATENT コマンドで設定されている形式 (STN 形式またはダウエント形式) で SELECT, ANALYZE されます。

サンプルレコード

ALL 形式での表示

AN 2000-457843 [200040] DPCI
 TI Video-signal encoder performs orthogonal transformation on video-signal block based on the judgment result obtained by correlating width and vertical direction coefficient of video-signal block
 IN MOON J H; MUN J H; PARK C S; SO J; SONG J H
 PA (HYNX-C) HYUNDAI ELECTRONICS IND CO LTD; (PCGO-C) PANTECH&CURITEL COMMUNICATIONS INC
 CYC 3
 PI JP 2000165880 A 20000616 (200040)* JA 31[24]
 KR 2000028531 A 20000525 (200110) KO
 US 6674910 B1 20040106 (200411) EN
 KR 530566 B1 20060517 (200913) KO [24]
 JP 4226172 B2 20090218 (200914) JA 38
 ADT JP 2000165880 A JP 1999-333450 19991124; KR 2000028531 A KR 1998-51131 19981124; KR 530566 B1 KR 1998-51131 19981124; JP 4226172 B2 JP 1999-333450 19991124; US 6674910 B1 US 1999-448820 19991124
 FDT JP 4226172 B2 Previous Publ JP 2000165880 A; KR 530566 B1 Previous Publ KR 2000028531 A
 PRAI KR 1998-51131 19981124
 KR 1998-4176 19981002

CTGS CITATION COUNTERS

 PNC. D 3 Cited Patents Count (total)
 PNC. DI 1 Cited Patents Count (by inv.)
 PNC. DX 2 Cited Patents Count (by exam.)
 PNC. DO 0 Cited Patents Count (in opp. doc.)
 PNC. DTH 0 Cited Patents Count (third party)
 PNC. DUN 0 Cited Patents Count (undefined)
 IAC. D 2 Cited Issuing Authority Count (total)
 IAC. DI 1 Cited Issuing Authority Count (by inv.)
 IAC. DX 2 Cited Issuing Authority Count (by exam.)
 IAC. DO 0 Cited Issuing Authority Count (in opp. doc.)
 IAC. DTH 0 Cited Issuing Authority Count (third party)
 IAC. DUN 0 Cited Issuing Authority Count (undefined)

 PNC. G 1 Citing Patents Count (total)
 PNC. GI 0 Citing Patents Count (by inv.)
 PNC. GX 1 Citing Patents Count (by exam.)
 PNC. GO 0 Citing Patents Count (in opp. doc.)
 PNC. GTH 0 Citing Patents Count (third party)
 PNC. GUN 0 Citing Patents Count (undefined)
 IAC. G 1 Citing Issuing Authority Count (total)
 IAC. GI 0 Citing Issuing Authority Count (by inv.)
 IAC. GX 1 Citing Issuing Authority Count (by exam.)
 IAC. GO 0 Citing Issuing Authority Count (in opp. doc.)
 IAC. GTH 0 Citing Issuing Authority Count (third party)
 IAC. GUN 0 Citing Issuing Authority Count (undefined)

 CRC 1 Cited Literature Reference Count (total)
 CRC. I 0 Cited Literature Reference Count (by inv.)
 CRC. X 0 Cited Literature Reference Count (by exam.)
 CRC. O 0 Cited Literature Reference Count (in opp. doc.)
 CRC. TH 0 Cited Literature Reference Count (third party)
 CRC. UN 1 Cited Literature Reference Count (undefined)

 OSC. D 3 Cited Patent WPI Accession Number Count (total)
 OSC. DX 2 Cited Patent WPI Accession Number Count (by exam.)
 OSC. DI 1 Cited Patent WPI Accession Number Count (by inv.)
 OSC. DO 0 Cited Patent WPI Accession Number Count (in opp. doc.)
 OSC. DTH 0 Cited Patent WPI Accession Number Count (third party)
 OSC. DUN 0 Cited Patent WPI Accession Number Count (undefined)
 OSC. G 1 Citing Patent WPI Accession Number Count (total)

ALL 形式での表示 (続き)

OSC.GX 1 Citing Patent WPI Accession Number Count (by exam.)
 OSC.GI 0 Citing Patent WPI Accession Number Count (by inv.)
 OSC.GO 0 Citing Patent WPI Accession Number Count (in opp. doc.)
 OSC.GTH 0 Citing Patent WPI Accession Number Count (third party)
 OSC.GUN 0 Citing Patent WPI Accession Number Count (undefined)

CDP Cited Patents

Citing Publication	By	Cat	Cited Patent	Date	Accession Number
US 6674910 B1	E		US 5978514 A	19991102	1996-467025
			PA: (TOKE-C) TOSHIBA KK IN: CHUJON T; DACHIKU K; IDA T; KIKUCHI Y; WATANABE T; YAMAGUCHI N		
	I		US 5010402 A	19910423	1991-148369
			PA: (MATU-C) MATSUSHITA ELEC IND CO LTD IN: NISHINO M		
JP 4226172 B2	E		JP 09214971 A	19970815	1997-246733
			PA: (HYNX-C) HYUNDAI ELECTRONICS IND CO LTD IN: CHUN S M; KIM J K; LEE J H; MOON J H; PARK G H		

REN Literature Citations

Citing Publication	By	Cat	Literature Reference
JP 4226172 B2	Undef		Moon, J. H., et al, Shape-Adaptive Region Partitioning Method for Shape-Assited Block-Based Texture Coding, IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, 1997X5E74 2X6708, Vol. 7, No. 1, P. 240-246

CGP Citing Patents

Cited Publication	By	Cat	Citing Patent	Date	Accession Number
US 6674910 B1	E	A	WO 2009088353 A1	20090716	2009-L52212
			PA: (TELF-C) TELEFONAKTIEBOLAGET ERICSSON L M IN: ANDERSSON K; FROEJDH P; PRIDDLE C; SAMUELSSON J; SJOEBERG R		

ALLB 表示形式での表示

AN 2000-457843 [200040] DPCI
 TI Video-signal encoder performs orthogonal transformation on video-signal block based on the judgment result obtained by correlating width and vertical direction coefficient of video-signal block
 IN MOON J H; MUN J H; PARK C S; SO J; SONG J H
 PA (HYNX-C) HYUNDAI ELECTRONICS IND CO LTD; (PCCO-C) PANTECH&CURITEL COMMUNICATIONS INC
 CYC 3
 PI JP 2000165880 A 20000616 (200040)* JA 31[24]
 KR 2000028531 A 20000525 (200110) KO
 US 6674910 B1 20040106 (200411) EN
 KR 530566 B1 20060517 (200913) KO [24]
 JP 4226172 B2 20090218 (200914) JA 38
 ADT JP 2000165880 A JP 1999-333450 19991124; KR 2000028531 A KR 1998-51131 19981124; KR 530566 B1 KR 1998-51131 19981124; JP 4226172 B2 JP 1999-333450 19991124; US 6674910 B1 US 1999-448820 19991124
 FDT JP 4226172 B2 Previous Publ JP 2000165880 A; KR 530566 B1 Previous Publ KR 2000028531 A
 PRAI KR 1998-51131 19981124
 KR 1998-4176 19981002

CTS CITATION COUNTERS

PNC. D	3	Cited Patents Count
PNC. G	1	Citing Patents Count
IAC. D	2	Cited Issuing Authority Count
IAC. G	1	Citing Issuing Authority Count
CRC	1	Cited Literature Reference Count
OSC. D	3	Cited Patent WPI Accession Number Count
OSC. G	1	Citing Patent WPI Accession Number Count

Citations

Cited Publication	By	Accession Number
JP 09214971 A	E	1997-246733
US 5978514 A	E	1996-467025
US 5010402 A	I	1991-148369

Literature Citations

By	Literature Reference
Undef	Moon, J.H., et al, Shape-Adaptive Region Partitioning Method for Shape-Assited Block-Based Texture Coding, IEEE Trans. on Circuits and Systems for Video Technology, 1997X5E74 2X6708, Vol. 7, No. 1, P. 240-246

Citings

Citing Publication	By	Accession Number
WO 2009088353 A1	E	2009-L52212

Citings

Citing Publication	By	Accession Number
US 7278508 B2	Ex	2004-806452